

Formtracer SV-C3200 и SV-C4500

Серия 525 - Профилометры-контурографы

Это высокоточные полуавтоматические устройства для измерения геометрии контура и шероховатости поверхности с высокоэффективным программным обеспечением FORMTRACERPAK.

Профилометр-контурограф Formtracer SV-C3200 обладает следующими преимуществами:

- Высокопроизводительный, как 2 отдельных специализированных измерительных устройства.
- Экономичное совмещение измерения шероховатости и контура в одном приборе.
- Расширенный диапазон измерения контура по оси Z1=60 мм и диапазон измерения шероховатости 800 мкм уже в стандартной комплектации.
- Быстросменные магнитные крепления щупов обеспечивают отличную гибкость и лёгкость эксплуатации.
- SV-C3200 гарантирует высокую точность и разрешение при измерениях по оси Z1.

Профилометр-контурограф Formtracer SV-C4500 обладает следующими преимуществами:

- Устройство с двусторонним щупом для измерений контура сверху и снизу.
- Расширенный диапазон измерения контура по оси Z1=60 мм и диапазон измерения шероховатости 800 мкм уже в стандартной комплектации.
- Измерительное усилие контролируется программным обеспечением FormtracerPAK.
- Быстросменные магнитные крепления щупов обеспечивают отличную гибкость и лёгкость эксплуатации.
- SV-C4500 гарантирует высокую точность и разрешение при измерениях по оси Z1.



Formtracer SV-C3200



Приводной блок профилометра

[Измерение шероховатости поверхности соответствует стандартам: EN ISO, VDA, JIS, ANSI и другим].



Приводной блок контурографа SV-C3200



Приводной блок контурографа SV-C4500

Спецификация

Ход traversы	ZZ = 300 мм / 500 мм
Диапазон измерения	X = 100 мм / 200 мм Контур: Z1 = 60 мм Шероховатость: Z1 = 800 мкм; 80 мкм; 8 мкм (до 2,4 мм с дополнительным щупом)
Скорость измерения	0,02 - 5 мм/с
Скорость привода	X = 0 - 80 мм/с ZZ = 0 - 30 мм/с
Погрешность	X = (0,8+0,01L) мкм (модели S4, H4, W4) X = (0,8+0,02L) мкм (модели S8, H8, W8) [L : длина перемещения (мм)] SV-C3200 : Z1 = (1,6+12H/100) мкм SV-C4500 : Z1 = (0,8+12H/100) мкм [H : изм. высота от горизонтального положения (мм)]
Диапазон наклона	±45°
Измерительное усилие	SV-C3200: 30 мН SV-C4500: 10, 20, 30, 40, 50 мН (контролируется программным обеспечением) Шероховатость: 0,75 мН / 4 мН
Программное обеспечение	FORMTRACERPAK

Дополнительные технические характеристики

Дополнительные принадлежности	Другие дополнительные и стандартные принадлежности перечислены далее в различных разделах принадлежностей и щупов.
-------------------------------	--



См. брошюру Formtracer SV-C3200 / 4500